



Рис. 5. Двумерные (а, в) и трехмерные (б, г) АСМ-изображения поверхности исходного (а, б) и обработанного ЭП (в, г) образцов

Fig. 5. Two-dimensional (a, c) and three-dimensional (b, d) atomic force microscopy (AFM) images of the surface of the original (a, b) and electron-beam-treated (c, d) samples